

Последовательный волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр LabCenter XRF-1800

Волнодисперсионный спектрометр Lab Center XRF-1800 компании Шимадзу расширяет сферу применения волнодисперсионных рентгеновских спектрометров.

- Качественный и количественный анализ в диапазоне от бериллия Be по уран U на рентгеновском спектрометре XRF-1800 за 2,5 минуты
- Картирование распределения элементов с шагом 250 мкм
- Локальный анализ в точке Ø 500 мкм с помощью микроклиматоров и встроенной цифровой камеры
- Качественный и количественный анализ с применением линий высших порядков
- Определение толщины и элементного состава плёнок органической природы методом фундаментальных параметров с использованием линий Комптоновского рассеяния, определение толщины и элементного состава неорганических покрытий
- Уникальная система пробоподачи образца



Технические характеристики:

Диапазон определяемых элементов	От Be по U, базовая комплектация от O по U
Рентгеновский генератор трубка параметры	Rh-анод с тонким торцевым окном, мощность 4 кВт опции: W, Pt, Cr аноды 60 кВ, 150 мА
Система охлаждения	Двойной контур, внутренний замкнутый для охлаждения анода, внешний открытый/замкнутый.
Держатели образцов	7 для массивных образцов, один для локального анализа
Размер образца	51 мм в диаметре, высота 38 мм
Первичные фильтры	Автоматическая смена 5 типов: Al, Ti, Ni, Zr, без фильтра
Апертуры	Автоматическая смена 5 типов: 500 мкм, 3, 10, 20, 30 мм
Кристаллы-анализаторы	LiF (200), PET, Ge, TAP стандартные; LiF (220), SX-52, SX-1, SX-14, SX-88, SX-98, SX-76, SX-410 опции
Детекторы	Сцинтилляционный счётчик (SC) для тяжелых элементов, Проточный пропорциональный счетчик (FPC) для лёгких элементов
Система подачи газа для FPC	Электронный контроль плотности; потребление газа 5 см ³ /мин
Контроль степени разрежения	Стабилизатор вакуума